



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0462

编 号	ETB160122
总页数	共 5 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 低介电常数发泡材料

型号规格: LF125/LF225/LF525

检验类别: 委托检验

生产单位: 广州市诚臻电子科技有限公司

委托单位: 广州市诚臻电子科技有限公司



中国赛宝实验室
元器件检测中心



注 意 事 项

1. 报告无“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
6. 一般情况,委托检验仅对来样负责。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号(27 路、138 路车经过)

通 信 处: 广州 1501 信箱工业和信息化部电子五所元器件检测中心

邮政编码: 510610

联系电话: 020-87237292、87236657

传 真: 020-87237149、87237181

投诉电话: 020-87237255、87236789



中国赛宝实验室

元器件检测中心

检 验 报 告

产品名称	低介电常数发泡材料			型号规格	LF125/LF225/LF525
				商 标	CHANGEN
生产单位	广州市诚臻电子科技有限公司			检验类别	委托检验
委托单位	广州市诚臻电子科技有限公司			检验地点	本实验室
生产方地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号 G5 栋 318				
委托方地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号 G5 栋 318				
样品数量	1 只	送样者	同委托单位	送样日期	2016 年 8 月 19 日
抽样地点	/	基 数	/	生产批号	201608
样品编号	1 [#]		检验日期	2016 年 8 月 26 日~2016 年 8 月 26 日	
检验环境	温度: 15℃~35℃ 相对湿度: 45%~75% 气压: 86kPa~106kPa				
检验项目	详见附表 1				
检 验 依 据	1、GB/T 1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数的推荐方法 2、委托方要求				
检 验 结 论	本实验室对 LF125/LF225/LF525 型低介电常数发泡材料按 GB/T 1409-2006 进行检验，结果见检验记录。 （检验单位盖章） 签发日期: 2016 年 8 月 31 日				
说 明	1. 本报告另附《检验记录》一份，共 3 页。 2. 检验依据“委托方要求”不涉及 CNAS 认可标准检验方法的偏离。				

主检:

水青生

审核:

[Signature]

批准:

吴琦

职务:

技术主管

(实
告)

附表 1

检验项目及技术要求

序号	检验项目	技 术 要 求	检 验 样品数 (只)	允许不 合格数 (只)	检验不 合格数 (只)	备注
1	相对介电常数	按GB/T 1409-2006及委托方要求进行 测试电压: 100mV, 测试频率: 10MHz~300MHz, 测量样品厚度t, 记 录10MHz、30MHz、50MHz、100MHz、 300MHz的测试值, 记录测试曲线。 要求: 记录实测值。	1	/	/	

— 验 上 专用 —

附表 2 主要检验仪器、设备清单

序 号	名 称	型号、规格	计量有效期
1	射频阻抗分析仪	E4991A	2016.07.04~2017.07.03
2	电子数显卡尺	0~200mm	2015.12.18~2016.12.17

注：本次检验均在所使用仪器设备计量有效期内进行。

—————结 束—————





中国认可
检测
TESTING
CNAS L0462

编 号	ETB160122
总页数	共 3 页

检 验 记 录

产品名称: 低介电常数发泡材料

型号规格: LF125/LF225/LF525

检验类别: 委托检验

生产单位: 广州市诚臻电子科技有限公司

委托单位: 广州市诚臻电子科技有限公司



中国赛宝实验室
元器件检测中心



测试原始记录

☒ 研制/☐ 委托单位: 广州市诚臻电子科技有限公司

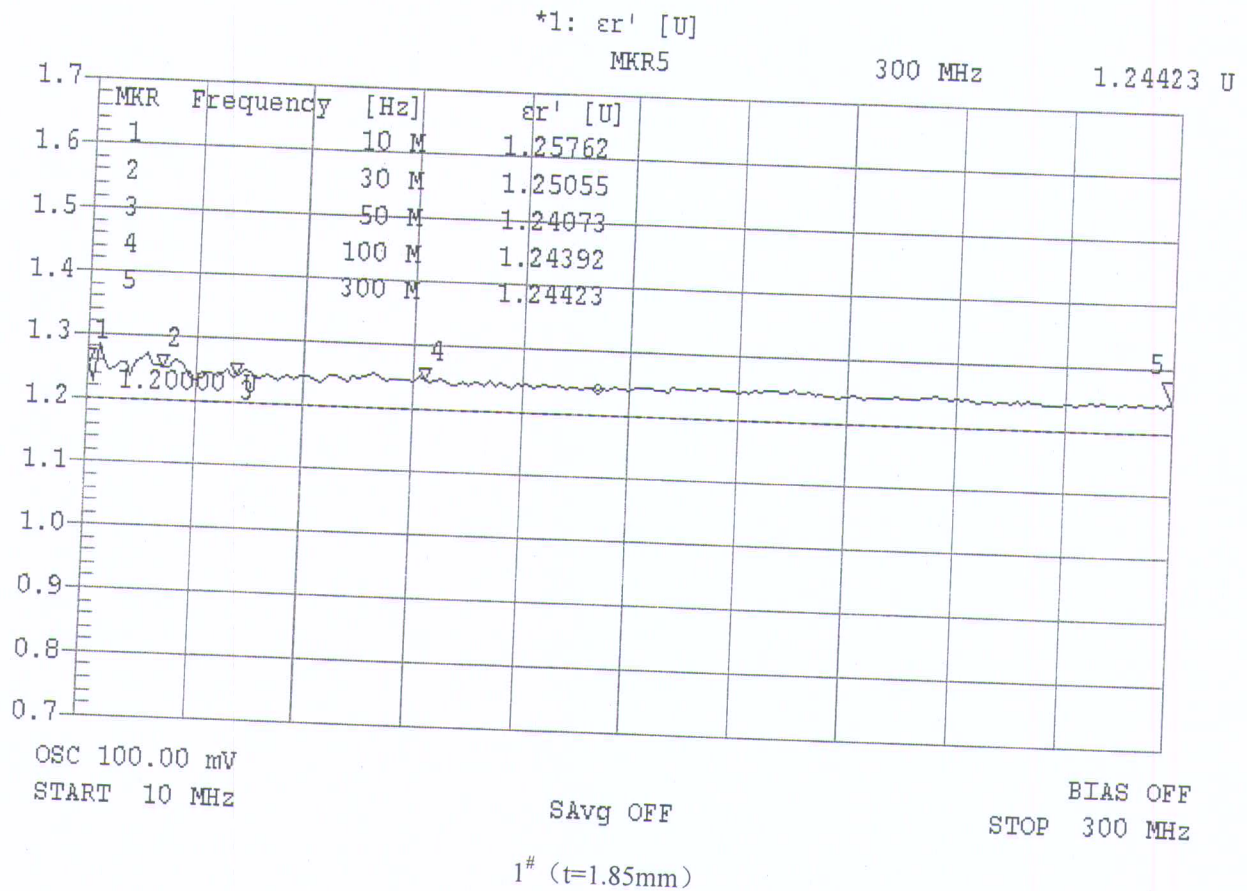
样品数量: 1

产品名称 型号规格	低介电常数发泡材料 LF125/LF225/LF525			组别	/
检 验 项 目	相对介电常数			环 境 条 件	温度: 24 °C 湿度: 48 %RH
主要测试 仪器名 称、型号	E4991A 射频阻抗分析仪	设 备 编 号	7531040007	计 量 有 效 期	2016.07.04~2017.07.03
	0~200mm 电子数显卡尺		K14C188215		2015.12.18~2016.12.17
测试依据 标准条款	按GB/T 1409-2006及委托方要求进行				
测试参数	相对介电常数				
测试条件	测试电压: 100mV, 测试频率: 10MHz~300MHz, 测量样品厚度 t, 记录 10MHz、30MHz、50MHz、100MHz、300MHz 的测试值, 记录测试曲线。				
技术要求	记录实测值				
样品编号	1				
	见附图				
	以下空白				
测试起始 结束时间	2016 年 8 月 26 日 13 时 30 分 ~ 2016 年 8 月 26 日 13 时 50 分				
备 注	本项目检验 <u>1</u> 只合格, <u>1</u> 只不合格, 本页记录更改盖章 <u>0</u> 处。				

宝实
(02)
书报告专

测试: 永青生 测试日期: 2016.08.26 审核: 李绍强 审核日期: 2016.08.26

测试原始记录 (续页)



测试人员: 水清生 测试日期: 2016.08.26 审核: 高铭强 审核日期: 2016.08.26